
**Émaux vitrifiés — Essai à basse
tension pour la détection et la
localisation des défauts —**

**Partie 1:
Essai avec tampon pour les surfaces
non profilées**

*Vitreous and porcelain enamels — Low-voltage test for detecting and
locating defects —*

Part 1: Swab test for non-profiled surfaces

ISO 8289-1:2020

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/9d139dfd-432b-4382-b0e1-29c3f55962d4/iso-8289-1-2020>



iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 8289-1:2020

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/9d139dfd-432b-4382-b0e1-29c3f55962d4/iso-8289-1-2020>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2020

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Principe	1
5 Réactif d'essai	2
6 Appareillage	2
6.1 Méthode A.....	2
6.2 Méthode B.....	2
7 Éprouvette	2
8 Mode opératoire	3
8.1 Détection électrique (méthode A).....	3
8.2 Détection optique (méthode B).....	3
9 Expression des résultats	3
10 Rapport d'essai	3
Bibliographie	5

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 8289-1:2020

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/9d139dfd-432b-4382-b0e1-29c3f55962d4/iso-8289-1-2020>